

TOF-SIMSによる最表面微量汚染分析

特長

1. 最表面に付着した無機・有機汚染の物質の同定が可能
2. PPMLレベルの高感度分析が可能
3. 最小5 μm 領域の点分析から5cm角までの広領域面分析が可能

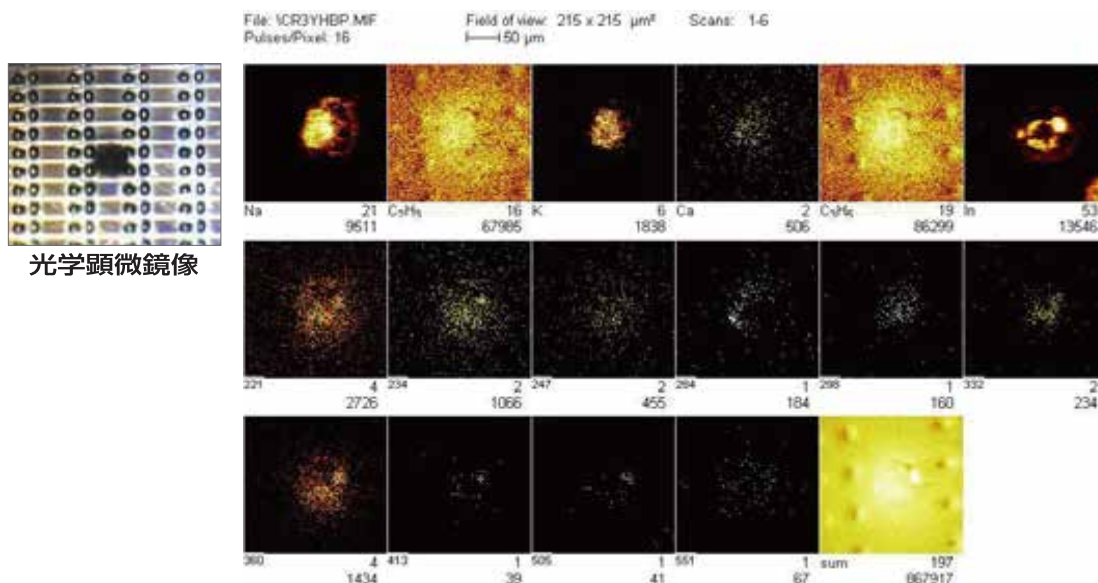
装置 / ION TOF TOF-SIMS IV

- 分析イオン …………… Ga, Ar
- スパッターイオン ……… Cs, Ar
- 検出方法
 - 飛行時間型質量分析
 - リフレクター型
- 分析領域
 - 最小分析領域: 約5 μm
 - 分析深さ: 1~2nm



適用例: 液晶ディスプレイ中異物の分析

- 分析例 液晶ディスプレイ内に見つかった異物の分析
- 測定結果 有機系のフラグメント以外に、ナトリウム、カリウム、カルシウムが検出された。人体に由来する異物の可能性が推測される。



お問い合わせは
こちらまで

株式会社アイテス
品質技術部

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 800 番地
TEL: 077-599-5020 FAX: 077-587-5901
URL: <http://www.ites.co.jp>